

Mikroskopie atomárních sil (AFM) je mladá a široce používaná metoda zobrazování povrchu, nanostruktur, biologických a dalších citlivých objektů pomocí rastrujícího hrotu na ohebném raménku. Při provozu na vzduchu dosahuje rozlišení několika nanometrů, toto rozlišení je závislé zejména na používaném hrotu. Předložená práce se zabývá modifikací použitých hrotů pomocí uhlíkových nanotrubiček (CNT) v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM) za využití techniky fokusovaného iontového svazku (FIB) a soustavy vstřikování plynných prekurzorů (GIS). Je zde prezentováno několik postupů přípravy vzorků CNT a jejich připevnění na hrot pro AFM. Funkčnost hrotů byla ověřována v AFM za pomoci kalibračních vzorků složených z definovaných nanostruktur.